CHOTEST · WT-100

Cabeça de medição híbrida (interferometria e confocal) WT-100

Cabeça de medição óptica sem contato que reúne interferometria de luz branca e microscopia confocal, feita para ser montada em plataformas XY e medir rugosidade e perfil 2D e 3D em linha de produção. É fornecida com SDK e tem as versões WT-100 e WT-100T, esta com nivelamento automático no modo de interferometria.



VISÃO GERAL

A WT-100 é uma cabeça de medição óptica sem contato que reúne as características de um interferômetro de luz branca e de um microscópio confocal. Foi feita para ser montada em qualquer plataforma com deslocamento XY e medir superfícies na própria linha de produção, entregando rugosidade, dimensões de contorno e outros parâmetros 2D e 3D.

Em superfícies ultralisas e transparentes, o modo de interferometria gera imagens sem distorção para análise de rugosidade e, segundo o fabricante, mede rugosidade de 0,1 nm ou menor e degraus nanométricos. Em superfícies rugosas com ângulos acentuados, o modo confocal reconstrói microtopografias com inclinação local próxima de 90°.

A série tem dois modelos: WT-100 e WT-100T. A diferença descrita pelo fabricante é o nivelamento automático no modo de interferometria, presente na versão T.

Recursos descritos pelo fabricante:

- busca automática de franjas, ajuste automático de brilho e definição automática da faixa de varredura;
- medição de um ponto por comando e medição por imagem de dimensões 2D (comprimento, ângulo e raio);
- medição e análise na mesma interface, com etapas pré-configuradas;
- processamento (ajuste de posição, remoção de ruído, filtragem e extração) e análise de rugosidade, contorno geométrico, estrutura, frequência e função, também em lote;
- relatórios em Word, Excel, CSV e PDF;
- proteção anticolisão por software e hardware e hibernação da fonte de luz;
- SDK e documentação de interface para integrar a cabeça ao equipamento do cliente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos da série	WT-100 e WT-100T; o WT-100T tem nivelamento automático no modo de interferometria
Princípio de medição	Interferometria de luz branca e microscopia confocal na mesma cabeça
Capacidade de medição	Interferometria: rugosidade de 0,1 nm ou menor e degraus nanométricos; confocal: microtopografia com inclinação local próxima de 90°
Tipos de superfície	Modo de interferometria: de ultralisas a rugosas, espelhadas, transparentes ou pretas, numa única modalidade de varredura
Integração	Montagem em plataformas com deslocamento XY, para medição em linha de produção; SDK e documentação de interface para integração personalizada
Medição por imagem	Dimensões 2D: comprimento, ângulo e raio
Funções automáticas auxiliares	Busca automática de franjas, ajuste automático de brilho, definição automática da faixa de varredura; nivelamento automático no modo de interferometria (WT-100T); medição de um ponto por comando
Medição programada	Medição e análise na mesma interface, com etapas de processamento e análise pré-configuradas executadas por um comando
Processamento de dados	Ajuste de posição, remoção de ruído, filtragem e extração
Análise de dados	Rugosidade, contorno geométrico, estrutura, frequência e análise funcional; análise em lote com modelos personalizados
Exportação de dados	Word, Excel, CSV e PDF, com imagens 2D e 3D, perfis e valores numéricos
Proteção anticolisão	Dupla, por software e hardware, protege a objetiva e o eixo de varredura
Proteção da fonte de luz	Hibernação automática quando o equipamento fica sem operador

Especificações informadas pelo fabricante, sujeitas a alteração sem aviso prévio. Confirme a configuração na proposta. Versão 11/2026.

FALE COM A PROBE

Proposta, configuração e suporte técnico no Brasil, com a equipe da Probe Systems.

- Indicação do modelo para a sua peça e tolerância
- Proposta com a configuração para a sua aplicação

(11) 4942-2222 · WhatsApp **(11) 96841-6776**
vendas@probesystems.com.br · probesystems.com.br
Rua Waldemar Martins Ferreira, 289 · São Bernardo do Campo, SP

Página do produto, vídeos e cotação